

01

## Теория объемного захвата частиц в режим каналирования

© В.П. Кощев

Сургутский государственный университет  
E-mail: koscheev@surgu.wsnet.ru

Поступило в Редакцию 24 сентября 2001 г.

Построена теория объемного захвата тяжелых релятивистских частиц в режим каналирования. Показано, что дискретность потенциала атомной плоскости изогнутого кристалла является причиной механизма упругих потерь энергии поперечного движения каналированных частиц, которые в  $10^7$  раз превосходят неупругие потери энергии поперечного движения.

Основные принципы теории объемного захвата частиц в режим каналирования были сформулированы в [1]. Указывалось [1], что объемный захват протонов в режим каналирования возможен в случае, когда упругие потери энергии поперечного движения превышают неупругие потери энергии поперечного движения в  $10^7$  раз. Упругий механизм потерь энергии поперечного движения частиц в изогнутых каналах кристалла состоит из двух слагаемых, одно из которых связано с многократным рассеянием на тепловых колебаниях атомов кристалла и квантовых флуктуациях местоположения атомных электронов. Влияние этого слагаемого на динамику объемного захвата частиц в режим каналирования было впервые исследовано методом компьютерного моделирования траекторий каналированных частиц в [2] и методом решения кинетического уравнения движения типа Фоккера–Планка в [3]. Второе слагаемое, которое обеспечивает упругий механизм потерь энергии частиц в изогнутых каналах кристалла, обусловлено дискретностью потенциала атомной плоскости. Цель настоящей статьи составляет построение теории объемного захвата частиц в режим каналирования, в которой учитывается вклад этих двух слагаемых.

Движение каналированных частиц происходит в электрическом потенциале кристалла, который складывается из кулоновских потенциалов атомных ядер, расположенных в узлах кристаллической решетки, и

кулоновских потенциалов атомных электронов:

$$U(r) = \sum_n \left( \frac{Ze^2}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_n|} - \sum_{j=1}^Z \frac{e^2}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_{nj}|} \right), \quad (1)$$

где  $Ze$  — заряд атомного ядра;  $\mathbf{r}_n = \mathbf{r}_{n0} + \delta\mathbf{r}_n$ ; вектор  $\delta\mathbf{r}_n$  определяет положение атомного ядра, смещенного из узла кристаллической решетки благодаря тепловым колебаниям;  $\mathbf{r}_{nj} = \mathbf{r}_{n0} + \delta\mathbf{r}_n + \delta\mathbf{r}_{nj}$ ; вектор  $\delta\mathbf{r}_{nj}$  определяет положение  $j$ -го электрона по отношению к положению  $n$ -го атомного ядра. Вектор  $\mathbf{r}_{n0}$  определяет положение  $n$ -го узла кристаллической решетки.

Усреднение по независимым тепловым колебаниям атомов кристалла осуществляется с помощью функции распределения Гаусса. Усреднение по квантовым флуктуациям местоположения атомных электронов осуществляется с помощью метода [4], который Бете использовал для вычисления атомного форм-фактора. Эти усреднения производятся по координатам всех ядер и электронов и обозначаются символами  $\langle \dots \rangle_T$  и  $\langle \dots \rangle_e$  соответственно. Потенциал кристалла может быть представлен в виде

$$U(r) = \bar{U} + \delta U_z(r) + \delta U(r), \quad (2)$$

где  $\bar{U} = \bar{U}(x)$  — непрерывный потенциал плоскостного канала кристалла, усредненный по тепловым колебаниям атомов;  $\delta U_z(r) = \langle U \rangle_{e,T} - \bar{U}$  — поправка к непрерывному потенциалу, связанная с дискретностью расположения атомов в плоскости, которая не является источником флуктуаций;  $\delta U(r) = U(r) - \langle U \rangle_{e,T}$  — флуктуация потенциала, вызванная тепловыми колебаниями атомных ядер и квантовыми флуктуациями местоположения атомных электронов.

Движение быстрых заряженных частиц в изогнутых плоскостных каналах кристалла будем описывать с помощью стохастического уравнения эволюции поперечной энергии, которое было построено в [5]:

$$\frac{d\varepsilon}{dt} = -\frac{2}{T(\varepsilon)} \int_{X_1(\varepsilon)}^{X_2(\varepsilon)} \frac{\partial}{\partial x} (\delta U + \delta U_z) \cdot dx, \quad (3)$$

где  $T(\varepsilon)$  — период колебаний частицы в плоскостном канале кристалла;  $X_{1,2}$  — точки поворота классической траектории каналированных частиц могут быть определены из уравнения  $U_{eff}(X_{1,2}) = \varepsilon$ ; эффективный

потенциал плоскостного канала изогнутого кристалла имеет вид

$$U_{eff}(x) = \bar{U}(x) - \frac{pvx}{R},$$

$pv$  — энергия налетающей частицы;  $R$  — радиус изгиба кристалла;  $y = s \cos \phi$ ;  $z = s \sin \phi$ ; угол  $\phi$  лежит в плоскости  $YOZ$  вдали от главных кристаллографических направлений;  $s \simeq vt$  — глубина проникновения каналированных частиц в кристалл.

Легко видеть, что дискретность атомной плоскости является причиной несохранения средней поперечной энергии каналированных частиц

$$\frac{d\bar{\epsilon}}{dt} = -\frac{2}{T(\bar{\epsilon})} \{ \delta U_z [X_2(\bar{\epsilon}), t] - \delta U_z [X_1(\bar{\epsilon}), t] \}. \quad (4)$$

Уравнение (4) содержит малый параметр, который равен отношению расстояния между атомами в плоскости к длине волны пространственных колебаний частицы в плоскостном канале кристалла. С помощью метода многих масштабов [6] уравнение (4) может быть преобразовано к виду

$$\frac{d\bar{\epsilon}}{dt} = -\frac{2}{T(\bar{\epsilon})} \{ \bar{U}[X_2(\bar{\epsilon})] - \bar{U}[X_1(\bar{\epsilon})] \}. \quad (5)$$

Уравнение (5) можно переписать в виде

$$\frac{d\bar{\epsilon}}{ds} = -\frac{2pv}{R\lambda_{ch.}} [X_2(\bar{\epsilon}) - X_1(\bar{\epsilon})], \quad (6)$$

где  $\lambda_{ch.} = vT(\bar{\epsilon})$  — длина волны пространственных осцилляций каналированных частиц в плоскостном канале кристалла.

С помощью (6) можно оценить величину упругих потерь поперечной энергии каналированных частиц в изогнутом кристалле

$$\left| \frac{d\bar{\epsilon}}{ds} \right|_{el.} \simeq \frac{2pv\Psi_L}{R\pi}, \quad (7)$$

где  $\Psi_L$  — критический угол каналирования Линдхарда [7]. Формула (7) получена при условии  $X_2(\bar{\epsilon}) - X_1(\bar{\epsilon}) \simeq d_p$  — межплоскостное расстояние;  $\lambda_{ch.} \simeq \pi d_p / \Psi_L$ . В [1] была дана оценка величины неупругих потерь поперечной энергии каналированных частиц

$$\left| \frac{d\bar{\epsilon}}{ds} \right|_{inel.} \simeq \Psi_L^2 \rho, \quad \text{MeV/cm}, \quad (8)$$

где  $\rho$  — плотность кристалла ( $\text{g/cm}^3$ ).

Критический угол Линдхарда лежит в пределах  $\Psi_L \simeq 10^{-4} - 10^{-6}$  rad. для протонов с энергией 1 GeV–10 TeV, каналированных в кристаллах кремния [1]. Критическое значение величины  $(pv/R)_{cr.} \simeq 5 \text{ GeV} \cdot \text{cm}^{-1}$  для кристалла кремния было определено из условия равенства центробежной силы и максимального значения кулоновской силы, которая действует на каналированную частицу со стороны атомной плоскости [8]. Легко видеть, что упругие потери энергии поперечного движения (7) не менее чем в  $10^7$  раз превосходят неупругие потери энергии поперечного движения (8) в полном согласии с [1].

## Список литературы

- [1] Сумбаев О.И. // ЖТФ. 1987. Т. 67. В. 11. С. 2067–2077.
- [2] Таратин А.М., Воробьев С.А. // ЖТФ. 1985. Т. 55. В. 8. С. 1598–1604.
- [3] Кудряшов Н.А., Петровский С.В., Стриханов М.Н. // ЖТФ. 1989. Т. 59. В. 4. С. 68–73.
- [4] Бете Г. Квантовая механика. М.: Мир, 1965. 333 с.
- [5] Коцеев В.П. // Письма в ЖТФ. 2001. Т. 27. В. 18. С. 61–64.
- [6] Найфэ А. Введение в методы возмущений. М.: Мир, 1984. 535 с.
- [7] Линдхард Й. // УФН. 1969. Т. 99. В. 2. С. 249–296.
- [8] Бирюков В.М., Котов В.И., Чесноков Ю.А. // УФН. 1994. Т. 164. № 10. С. 1017–1040.